

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

по докторской диссертации Дьяковой Ю.А. «Самоорганизация белковых молекул при формировании кристаллов и пленок»

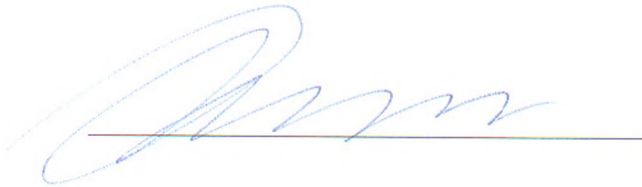
01.04.18 – кристаллография, физика кристаллов.

Фамилия, имя, отчество оппонента	Суворов Эрнест Витальевич
Дата рождения	07.11.1937
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	01.04.07 – физика конденсированного состояния
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук
Ученое звание	Профессор
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук
Почтовый адрес с указанием индекса	142432 Черноголовка, Московская обл., ул. Институтская, 2
Занимаемая должность	Главный научный сотрудник лаб. структурных исследований
Телефон	8-903-672-3851
Адрес электронной почты	suvorov@issp.ac.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в	<ol style="list-style-type: none">1. Suvorov E.V., Smirnova I.A. A new high-sensitivity X-ray diffraction technique for determining local deformations of a crystal surface using «bending interference fringes» // Technical Physics Letters. 2016. V. 42. № 9, P. 955.2. Asadchikov V., Buzmakov A., Chukhovskii F., Dyachkov I., Zolotov D., Danilewsky A., Baumbach T., Bode S., Хаага, S., Hänschke, D., Kabukcuoglu M., Balzer M., Caselle M., Suvorov E.

рецензируемых
научных
изданиях за
последние 5 лет

- X-ray topotomography studies of linear dislocations in silicon single crystals // Journal of Applied Crystallography. 2018. V. 51. № 6. P. 1616.
3. Суворов Э.В. Рентгеновская топография: вчера, сегодня и перспективы // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2018. № 9, С. 3.
 4. Smirnova I.A., Shulakov E.V., Suvorov E.V. Forming an Edge Dislocation Image at Anomalous X-ray Transmission // Physics of the Solid State. 2019. V. 61, № 8, P. 1444.
 5. Zolotov D.A., Asadchikov V.E., Buzmakov A.V., D'yachkova I.G., Krivonosov Y.S., Chukhovskii F.N., Suvorov E.V. X-ray Diffraction Tomography Using Laboratory Sources for Studying Single Dislocations in a Low Absorbing Silicon Single Crystal // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 2019. V. 55. № 2. P. 126.
 6. Золотов Д.А., Асадчиков В.Е., Бузмаков А.В., Дьячкова И.Г., Кривонос Ю.С., Чуховский Ф.Н., Суворов Э.В. Рентгеновская дифракционная томография с применением лабораторных источников для исследования одиночных дислокаций в слабопоглощающем монокристалле кремния. // Автометрия 2019. Т. 55, № 2, С. 28-35.

Д.ф.-м.н., проф. Суворов Э.В.



Подпись Суворова Э.В. заверяю
Ученый секретарь к.ф.-м.н.
Терещенко Алексей Николаевич



9 июля 2021 г.